

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成26年3月13日(2014.3.13)

【公開番号】特開2013-231631(P2013-231631A)

【公開日】平成25年11月14日(2013.11.14)

【年通号数】公開・登録公報2013-062

【出願番号】特願2012-102819(P2012-102819)

【国際特許分類】

G 0 1 N 21/88 (2006.01)

G 0 1 N 21/956 (2006.01)

G 0 1 B 11/30 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 21/88 J

G 0 1 N 21/956 A

G 0 1 B 11/30 A

【手続補正書】

【提出日】平成26年1月28日(2014.1.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

また、別の光子計数法の一例として、多数のアバランシェフォトダイオード画素を配列して構成した検出器の、各画素への光子の入射により発生するパルス電流の合計を計測する方法が知られている。この検出器はSi-PM(Silicon Photomultiplier)、PPD(Pixelated Photon Detector)、あるいはMPPC(Multi-Pixel Photon Counter、登録商標、商標権者：浜松ホトニクス株式会社)などと呼ばれる。この方法によれば、前述の単一の光電子増倍管やアバランシェフォトダイオードを用いた光子計数と異なり、応答速度が早いので短い時間内に複数個の光子が入射した場合も光量を計測することが可能である。ただし、多数のアバランシェフォトダイオードを配列したものが一つの「画素」を持つ検出器として動作するため、複数の画素の並列検出により高速あるいは高感度の欠陥検査においてこの方法を適用することができなかった。